第11章 (pp. 128)

統計的仮説検定

統計的仮説検定の考え方と流れ

統計的仮説検定の過程

①帰無仮説の設定

②検定統計量の作成

③危険率αの棄却域Rの設定

④仮説検定の判断

①帰無仮説の設定

• 分析者がやること: 帰無仮説・対立仮説を設定する

- 帰無仮説 (null hypothesis)
 - 棄却したい仮説
 - ・ 母平均 μ_X は μ_0 である
 - 「平均購入金額は600円である」
 - H_0 : $\mu_X = 600$
- 対立仮説(alternative hypothesis)
 - 帰無仮説が棄却されたときに採択される仮説
 - 主張したいことは対立仮説に設定
 - 母平均 μ_X は μ_0 ではない
 - 「平均購入金額は600円ではない」←主張したいこと
 - $H_1: \mu_X \neq 600$

【基本の考え方】 統計データと仮説に 矛盾が生じたときに 仮説を棄却する

①帰無仮説の設定

• 分析者がやること: 帰無仮説・対立仮説を設定する

- 両側検定
 - 分布の両側を考慮

$$-\begin{cases} H_0: \mu_X = \mu_0 \\ H_1: \mu_X \neq \mu_0 \end{cases}$$

- 製品の品質に差がある or 違いがない
- 片側検定
 - 分布の片側を考慮

$$-\begin{cases} H_0: \mu_X = \mu_0 \\ H_1: \mu_X > \mu_0 \end{cases}$$

• 製品の品質が従来よりも優れている or 違いがない

②検定統計量の作成

- 統計的に計算されること: 検定統計量
- 検定統計量T₀
 - 帰無仮説が真ならば T_0 は自由度n-1のt分布にしたがう
- 母分散が未知の場合には検定統計量は T_0 (t分布)

$$-T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_X^2}{n}}}$$
 ←母分散の代わりに標本不偏分散 \Rightarrow t分布

母分散が既知の場合には検定統計量はZ₀(標準正規分布)

$$- Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n}}} \quad \leftarrow 母分散 \quad \Rightarrow \quad 標準正規分布$$

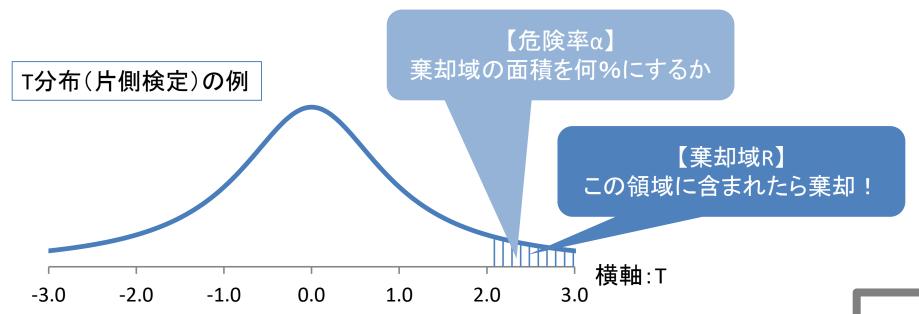
③危険率aの棄却域Rの設定

• 分析者がやること: 危険率(有意水準) aを決める

• 統計的に計算されること: 棄却域R(t分布表から求める)

・ 危険率aの棄却域R

- 検定統計量がこの領域に含まれるときに 帰無仮説を棄却することを定めた領域

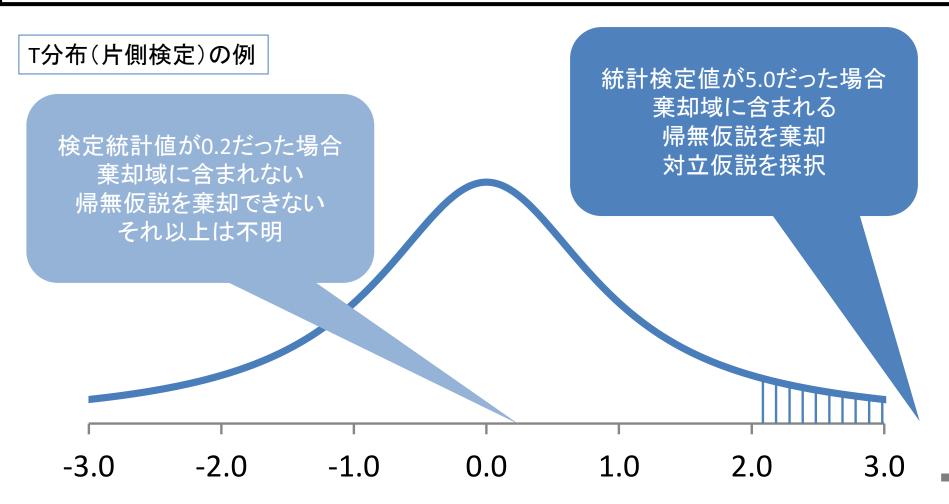


④仮説検定の判断

- 統計的に計算されること: 検定統計値to
- 標本の統計データを検定統計量 T_0 に代入して統計検定値 t_0 を計算
 - 検定統計値が棄却域Rに含まれたら 帰無仮説を棄却して対立仮説を採択
 - 主張したいことが言えた!
 - 統計検定値が棄却域Rに含まれなかったら 帰無仮説を棄却できない
 - 帰無仮説が棄却できなかったからと言って 帰無仮説を採択するとは言わない
 - 帰無仮説が正しいとは限らないため

④仮説検定の判断

• 統計的に計算されること: 検定統計値 t_0



第Ⅰ種の過誤と第Ⅱ種の過誤

仮説検定が誤りを犯す可能性

- 第 I 種の過誤
 - 帰無仮説が正しいのに、間違って棄却する
 - 危険率の設定で制御することが可能
- 第Ⅱ種の過誤
 - 対立仮説が正しいのに、間違って採択しない
 - ・ 第 Ⅱ 種の過誤が起こる確率は関数となる
 - 対立仮説 $H_1: \mu_X = \mu_1$ の値によって異なる値をとる
 - $-\mu_1$ が μ_0 に近いときには起こる確率 β が高くなる
 - このため、検定統計値が棄却域に含まれなかったときに 「帰無仮説を採択する」とは断言できない

		仮説検定の判断	
		帰無仮説を 棄却する	帰無仮説を 棄却しない
事実	帰無仮説が真	第Ⅰ種の過誤	正
	帰無仮説が偽	正	第Ⅱ種の過誤

第11章のまとめ

- 統計的仮説検定
 - 標本における統計データと仮説に矛盾が生じたときに仮説を棄却する
- 分析者が設定する必要があるもの
 - 帰無仮説
 - 対立仮説
 - 危険率(有意水準)
- 帰無仮説が真のとき
 - 統計検定量は既知の確率分布にしたがう
- 統計検定値が棄却域に含まれるとき
 - 「帰無仮説を棄却する」
- 統計検定値が棄却域に含まれなかったとき
 - 「帰無仮説を採択する」とは言わない
- 第 I 種の過誤・第 II 種の過誤
 - 仮説検定が誤りを犯す可能性